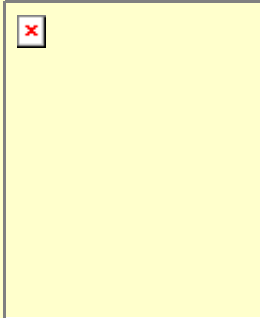


本期封面



2002年6期

栏目:

DOI:

论文题目: GaN场发射高分辨电子显微像的图像处理-显示GaN中原子分辨率晶体缺陷的可能性

作者姓名: 王怀斌 李方华

工作单位: 中国科学院物理研究所和中国科学院凝聚态物理中心, 北京100080

通信作者: 李方华

通信作者Email: lifh@aphy.iphy.ac.cn

文章摘要: 本文介绍了场发射高分辨电子显微像的图像处理原理, 用300 kV场发射电子显微镜的参数模拟了GaN完整晶体和缺陷晶体结构模型的显微像. 经过处理的显微像上能够分辨间距为0.112nm的Ga和N原子, 并能显示N原子空位.

关键词: GaN, 晶体缺陷, 高分辨电子显微学

分类号: 0766, 077

关闭